

Mikroskop metalograficzny Nikon Eclipse LV150N



Opis techniczny:

Mikroskop świetlny (LM) umożliwia obrazowanie w świetle odbitym w jasnym polu (BF), ciemnym polu (DF), świetle spolaryzowanym (POL) oraz kontraście interferencyjnym tzw. kontraście Nomarskiego (DIC). Posiada w pełni zmotoryzowany stolik (X,Y,Z), pozwalający na automatyczne robienie zdjęć w powiększonej głębi ostrości (EDF), wraz z trójwymiarowym obrazowaniem powierzchni, a także pozwala na automatyczne skanowanie całych zglądów metalograficznych w wysokiej rozdzielczości.

Nazwa handlowa: NIKON ECLIPSE LV150N

Więcej szczegółów: </equipment/mikroskop-metalograficzny/>

Rodzaj dostępu: Zewnętrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Cios Grzegorz

Osoba kontaktowa - adres strony www: <https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html>

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespół: Zakład Inżynierii Materiałowej

Data ostatniej aktualizacji: 10 marca 2025 13:39

Rok wprowadzenia do użytkowania: 2023

Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną

Możliwości badawcze:

Mikroskop świetlny (LM) umożliwia obrazowanie w świetle odbitym w jasnym polu (BF), ciemnym polu (DF), świetle spolaryzowanym (POL) oraz kontraście interferencyjnym tzw. kontraście Nomarskiego (DIC). Posiada w pełni zmotoryzowany stolik (X,Y,Z), pozwalający na automatyczne robienie zdjęć w powiększonej głębi ostrości (EDF), wraz z trójwymiarowym obrazowaniem powierzchni, a także pozwala na automatyczne skanowanie całych zglądów metalograficznych w wysokiej rozdzielczości.

Warunki udostępniania infrastruktury:

Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMiN. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_Wspolpraca/Aparatura/Zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_ACMiN.pdf)